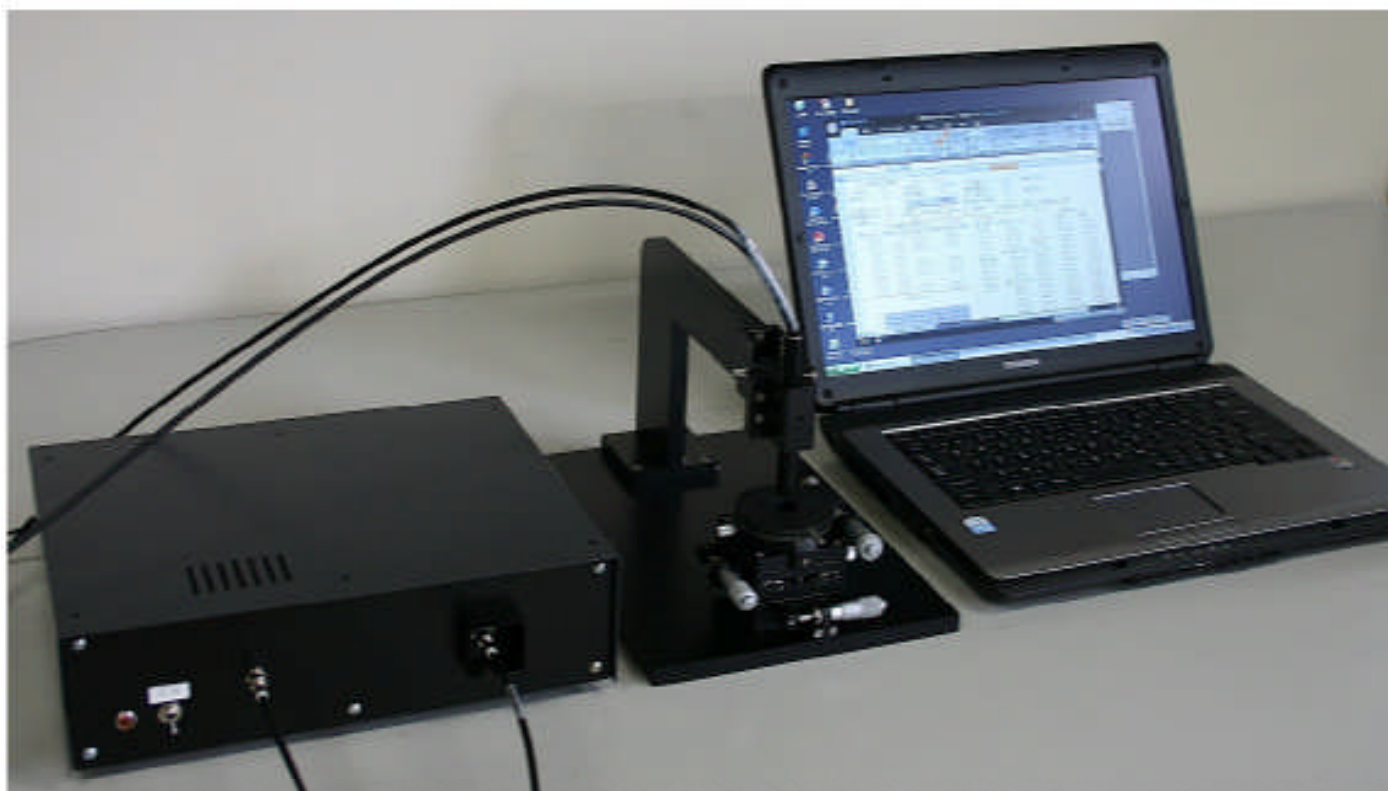


DLC 対応膜厚測定装置

MODEL : EL2



製造元：有限会社 オプトエレクトロニクスラボラトリ
販売先：ミワオプト株式会社

MIWAOPTO

概要

EL2 は光学的な手法により、DLC（ダイヤモンド状カーボン）膜厚を、非接触で、高精度に測定できる装置です。サンプルをステージに置くだけで、簡単な操作で DLC 膜厚を数秒で測定できます。

特許取得済み

主な仕様

サンプルの形状：平面だけでなく、円筒や球面上の膜厚も測定できます。

サンプルの大きさ：1mm 角（平面）、直径 1mm（円筒、球）程度以上

基板の材料：金属（鉄、アルミ、SUS など）、シリコン、ガラス、プラスチック、ゴムなど

測定可能膜厚：0.5 ~ 30 ミクロン（0.2 ミクロンまで測定可能なオプションもあります）

測定精度：± 5%

Si キャリアのような大型のサンプルにも適用できます（オプション）

円筒の内面にコートした DLC 膜にも適用できます。

屈折率も測定できます（オプション）

注意：表面状態によっては測定しにくい場合があります。

測定可能な形状例



球(直径 1mm)



機械部品



円柱(外径 1mm)



円筒内面(内径 12mm)

製造元



(有)オプトエレクトロニクスラボラトリ

販売先

MIWAOPTO

ミワオプト株式会社

〒143-0026

東京都大田区西馬込 2-17-18

TEL:03-5742-2181 FAX:03-5742-2188

<http://www.miwaopto.co.jp>

e-mail:info@miwaopto.co.jp